

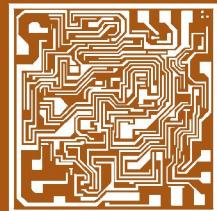
ISSN 0544-1269

Том 53, Номер 6

Ноябрь–Декабрь 2024



МИКРОЭЛЕКТРОНИКА



СОДЕРЖАНИЕ

Том 53, номер 6, 2024

ДИАГНОСТИКА

Состав газовой фазы и кинетика атомов фтора в плазме SF₆
A. B. Мяконьких, B. O. Кузьменко, A. M. Ефремов, K. B. Руденко

459

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Влияние дефектов изготовления и электрических шумов на эволюцию зарядового кубита с оптическим управлением

A. B. Щуканов, И. Ю. Катеев

469

МЕМРИСТОРЫ

Моделирование особенностей работы мемристивного кроссбар-массива в нейроморфных электронных модулях

A. П. Дудкин, Е. А. Рындин, Н. В. Андреева

483

Краткий обзор типологии нейронов и анализ использования мемристорных кроссбаров

A. A. Токарев, И. А. Хорин

496

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование структурных свойств и явления переноса в легированных многокомпонентных 2D полупроводниках

C. M. Асадов, C. H. Мустафаева, A. H. Маммадов, B. F. Лукичев

513

ПРИБОРЫ

III-нитридные НЕМТ гетероструктуры с ультратонким барьером AlN: получение и экспериментальное применение

A. С. Гусев, A. О. Султанов, P. B. Рыжук, T. N. Неволина,
Д. Чунваза, Г. К. Сафарлиев, Н. И. Каргин

539

Биполярный транзистор с туннельным пробоем

C. Ш. Рехвиашвили, Д. С. Гаев

553

ТЕХНОЛОГИИ

Параметры плазмы и кинетика травления Si/SiO₂ в смесях фторуглеродных газов с аргоном и гелием

A. M. Ефремов, B. B. Бетелин, K.-H. Kwon

559

Исследование проводимости углеродных нанотрубок, осажденных на подложку на основе силицида иридия-кремний

Э. А. Керимов

570

CONTENTS

No. 6, 2024

DIAGNOSTICS

Composition of the gas phase and kinetics of fluorine atoms in SF₆ plasma

A. V. Myakonikh, V. O. Kuzmenko, A. M. Efremov, K. V. Rudenko

459

QUANTUM TECHNOLOGIES

The influence of manufacturing defects and electrical noise on the evolution of a charge qubit with optical control

A. V. Tsukanov, I. Yu. Kateev

469

MEMRISTORS

Modeling of the features of the memristive crossbar array in neuromorphic electronic modules

A. P. Dudkin, E. A. Ryndin, N. V. Andreeva

483

A brief overview of the typology of neurons and an analysis of the use of memristor crossbars

A. A. Tokarev, I. A. Khorin

496

MODELING

Modeling of structural properties and transfer phenomena in doped multicomponent 2D semiconductors

C. M. Asadov, S. N. Mustafayeva, A. N. Mammadov, V. F. Lukichev

513

INSTRUMENTATION

III-nitride HEMT heterostructures with an ultrathin AlN barrier: preparation and experimental application

A. S. Gusev, A. O. Sultanov, R. V. Ryzhuk, T. N. Nevolina, D. Tsunvaza, G. K. Safarliev, N. I. Kargin

539

Bipolar transistor with tunnel breakdown

S. Sh. Rekhviashvili, D. S. Gaev

553

TECHNOLOGIES

Plasma parameters and kinetics of Si/SiO₂ etching in mixtures of fluorocarbon gases with argon and helium

A. M. Efremov, V. B. Betelin, K.-H. Kwon

559

Investigation of the conductivity of carbon nanotubes deposited on a substrate based on iridium silicide-silicon

E. A. Kerimov

570